

Rys. 2. Charakterystka funkcji przetwarzania  $U_{wy} = f(\vartheta)$

- a. Pomiar temperatury w laboratorium z wykorzystaniem Pt100 pracującym w układzie mostka

$$\vartheta_x =$$

- b. Pomiar temperatury w laboratorium z wykorzystaniem Pt100 poprzez wyznaczenie  $\vartheta_x$  na podstawie pomiaru rezystancji omomierzem cyfrowym i równania przetwarzania czujnika rezystancyjnego:

$$R_x =$$

$$\vartheta_x =$$

## 2. Moduł kondycjonowania sygnałów 2, 3 lub 4 przewodowego czujnika RTD

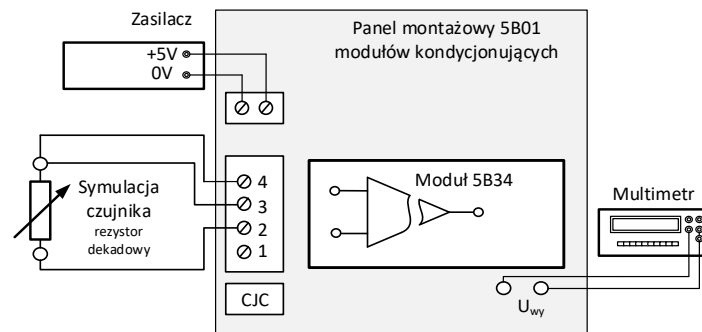
- 2.1. Zapoznać się z budową modułu kondycjonującego Analog Devices **5B34**. Zestawić układ do testowania modułu zainstalowanego na panelu 5B01. Przed podłączeniem zasilania, przeprowadzić kontrolę polaryzacji i wartości napięcia zasilającego 5V. Do zacisków wejściowych modułu podłączyć dekadowy rezystor nastawny o rozdzielczości  $0.01\Omega$  w układzie 3-przewodowym, na wyjściu podłączyć multimetr pracujący w trybie pomiaru napięcia stałego o rozdzielczości co najmniej  $5 \times 9$ . Wyznaczyć charakterystykę przetwarzania  $\vartheta = f(R_\vartheta)$  dla modułu 5B34-C-01 (przetwornik miedziany  $10\Omega$   $0-120^\circ\text{C}$ ) dla zmian rezystancji w zakresie  $9.5-14.5\Omega$  z krokiem  $0.5\Omega$ . Wyznaczyć współczynnik temperaturowy  $\alpha$  czujnika.

$\vartheta$ [°C]												
$R_{\vartheta}$ [Ω]	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	
$U_w$ [mV]												

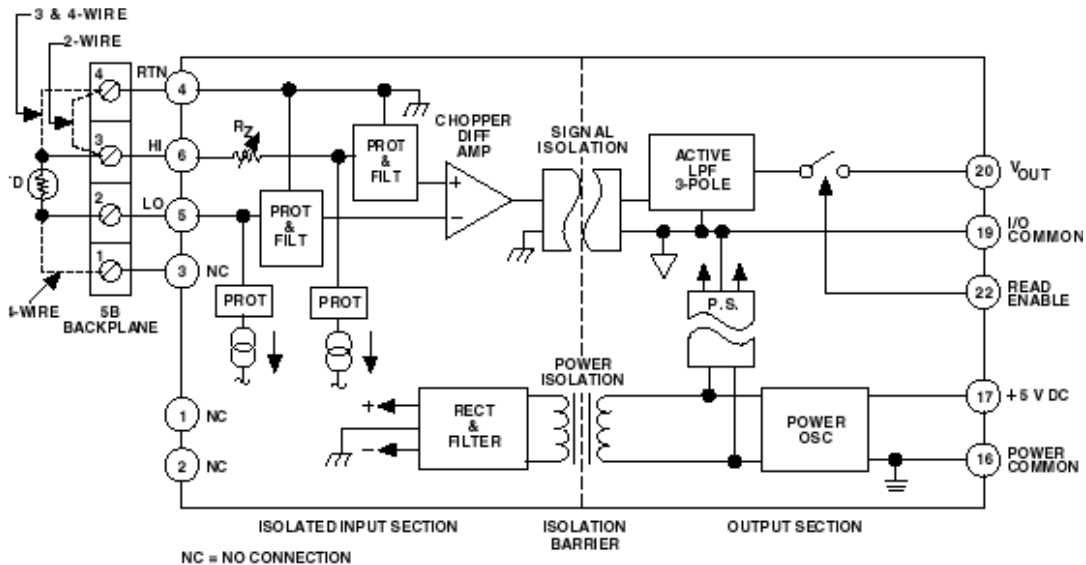
Przedstawić graficznie charakterystyki:

$$U = f(R), \vartheta = f(U), R = f(\vartheta)$$

### 3. Pomiary przy wykorzystaniu modułu kondycjonującego 5B34-C-01



Rys. 3. Schemat pomiarowy badania modułu kondycjonującego 5B34-C-01



Rys. 4. Schemat blokowy modułu kondycjonującego serii 5B34-C-01

Tabela 1. Charakterystyka toru pomiarowego z modułem kondycjonującym 5B34-C-01

$\vartheta$ [°C]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
$R_{\vartheta}$ [Ω]													

U[V]	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
$R_{\vartheta}$ [Ω]											
$\vartheta$ [°C]											

gdzie:

$R_{\vartheta}$  – wartość rezystancji symulowanej rezystorem dekadowym w układzie kondycjonującym,



